(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年4 月28 日 (28.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/038443 A1

(51) 国際特許分類7:

G01N 21/85, 21/27

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015219

(22) 国際出願日:

2004年10月15日(15.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-357763

2003 年10 月17 日 (17.10.2003)

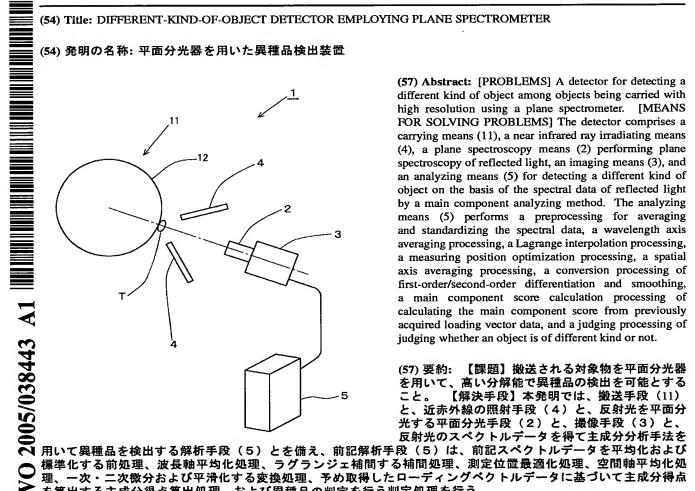
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 藤沢 薬品工業株式会社 (FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5418514 大阪府大阪市中央区道 修町3丁目4番7号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 本田 孝善 (HONDA, Takayoshi) [JP/JP]; 〒5418514 大阪府大 阪市中央区道修町3丁目4番7号藤沢薬品工業 株式会社内 Osaka (JP). 西山 太一郎 (NISHIYAMA, Talchirou) [JP/JP]; 〒5360023 大阪府大阪市城東区東 中浜9-7-6 Osaka (JP). 須賀 康之 (SUGA, Yasuyuki) [JP/JP]; 〒5418514 大阪府大阪市中央区道修町 3 丁目 4番7号 藤沢薬品工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 杉本 勝徳 (SUGIMOTO, Katsunori); 〒 5430051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 14番22号日進ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

/続葉有/

(54) Title: DIFFERENT-KIND-OF-OBJECT DETECTOR EMPLOYING PLANE SPECTROMETER



標準化する前処理、波長軸平均化処理、ラグランジェ補間する補間処理、測定位置最適化処理、空間軸平均化処 理、一次・二次微分および平滑化する変換処理、予め取得したローディングベクトルデータに基づいて主成分得点 を算出する主成分得点算出処理、および異種品の判定を行う判定処理を行う。



LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。